Β3.1. Φασματοφωτόμετρα, UV-VIS, μονής δέσμης (Β.24)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Β3.1. Φασματοφωτόμετρα, UV-VIS, μονής δέσμης | | | | | |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | **Α. Γενικά χαρακτηριστικά – απαιτήσεις:** |  |  |  |
| 1 | Φασματοφωτόμετρο απλής δέσμης (single beam) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Διαθέτει αυτόματο σύστημα στήριξης 4 κυψελίδων των 10 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Δυνατότητα αποθήκευσης των παραμέτρων και δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Δυνατότητα λήψης δεδομένων σε εκτυπωτή και θύρα RS232 (προαιρετικά RS485 και USB θύρες). | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Διαθέτει επιλογές εύρους φασματικής γραμμής, 2 nm, 5 nm και 1 nm. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Περιοχή μήκους κύματος λειτουργίας: 190 – 1100 nm | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Εύρος μονοχρωματικής δέσμης: 2 nm (5 nm, και 1 nm προαιρετικά) | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Διαχεόμενο φως: ≤ 0,1 %T (NaI, 220nm, NaNO2 340nm) | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ακρίβεια μήκους κύματος: ±0,5 nm. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Επαναληψιμότητα μήκους κύματος: 0,2 nm | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Εύρος φωτομέτρησης: -0,3 – 3A | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Ακρίβεια φωτομέτρησης: ±0,3%T(0-100%T), ±0,002A(0-0,5A), ±0,004A(0,5A-1A) | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Επαναληψιμότητα φωτομέτρησης: ± 0,2 %T | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Baseline flatness: ±0,002 A | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Σταθερότητα: 0,001 Α/60 min (στα 500 nm, μετά από προθέρμανση) | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Θόρυβος: ± 0,001 Α (στα 500 nm, μετά από προθέρμανση) | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Ανιχνευτής: Silicon photodiode | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Το φασματοφωτόμετρο να συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα ( λυχνίες, κυψελίδες, υποδοχείς). | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Ενδείξεις σε ψηφιακή οθόνη LCD. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Δυνατότητα λειτουργίας σε 220 V/50 Hz. | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Πιστοποίηση ISO 9001, ISO 14000, CE mark | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Eγγύηση καλής λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Ποσότητα | 5 |  |  |